

発信人 日本国特許庁（国際予備審査機関）



| |
|---|
| 出願人代理人 藤村 元彦 殿 あて名 〒 104-0045 東京都中央区築地4丁目1番17号 銀座大野ビル 藤村国際特許事務所 |
|---|

PCT見解書

(法第13条)
[PCT規則66]

| | |
|----------------|-----------|
| 発送日 (日.月.年) | 25.5.2004 |
|----------------|-----------|

| | |
|-------------------|-------------|
| 出願人又は代理人 の書類記号 | PCT01-03035 |
|-------------------|-------------|

| | |
|------|----------------|
| 応答期間 | 上記発送日から 2 月 以内 |
|------|----------------|

| | | |
|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 国際出願番号 PCT/JPO3/12406 | 国際出願日 (日.月.年) 29.09.2003 | 優先日 (日.月.年) 15.10.2002 |
|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|

| |
|---|
| 国際特許分類 (IPC) Int. Cl ⁷ H01S 5/323 |
|---|

| |
|---------------------------|
| 出願人 (氏名又は名称) バイオニア株式会社 |
|---------------------------|

1. これは、この国際予備審査機関が作成した 1 回目の見解書である。
2. この見解書は、次の内容を含む。
- I ☒ 見解の基礎
 - II ☐ 優先権
 - III ☐ 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解の不作成
 - IV ☐ 発明の単一性の欠如
 - V ☒ 法第13条 (PCT規則66.2(a)(ii)) に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付けるための文献及び説明
 - VI ☐ ある種の引用文献
 - VII ☐ 国際出願の不備
 - VIII ☐ 国際出願に対する意見
3. 出願人は、この見解書に応答することが求められる。
いつ? 上記応答期間を参照すること。この応答期間に間に合わないときは、出願人は、法第13条 (PCT規則66.2(d)) に規定するとおり、その期間の経過前に国際予備審査機関に期間延長を請求することができる。ただし、期間延長が認められるのは合理的な理由があり、かつスケジュールに余裕がある場合に限られることに注意されたい。
- どのように? 法第13条 (PCT規則66.3) の規定に従い、答弁書及び必要な場合には、補正書を提出する。補正書の様式及び言語については、法施行規則第62条 (PCT規則66.8及び66.9) を参照すること。
- なお 補正書を提出する追加の機会については、法施行規則第61条の2 (PCT規則66.4) を参照すること。補正書及び/又は答弁書の審査官による考慮については、PCT規則66.4の2を参照すること。審査官との非公式の連絡については、PCT規則66.6を参照すること。
- 応答がないときは、国際予備審査報告は、この見解書に基づき作成される。
4. 国際予備審査報告作成の最終期限は、PCT規則69.2の規定により 15.02.2005 である。

| | | |
|--|---------------------------|---------|
| 名称及びあて先 日本国特許庁 (IPEA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号 | 特許庁審査官 (権限のある職員) 吉野 三寛 | 2K 9010 |
| 電話番号 03-3581-1101 内線 3253 | | |

I. 見解の基礎

1. この見解書は下記の出願書類に基づいて作成された。(法第6条(PCT14条)の規定に基づく命令に応答するために提出された差替え用紙は、この見解書において「出願時」とする。)

☒ 出願時の国際出願書類

- | | | |
|-------------------------------------|----------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> 明細書 | 第 _____ ページ、 | 出願時に提出されたもの |
| <input type="checkbox"/> 明細書 | 第 _____ ページ、 | 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの |
| <input type="checkbox"/> 明細書 | 第 _____ ページ、 | 付の書簡と共に提出されたもの |
| <input type="checkbox"/> 請求の範囲 | 第 _____ 項、 | 出願時に提出されたもの |
| <input type="checkbox"/> 請求の範囲 | 第 _____ 項、 | PCT19条の規定に基づき補正されたもの |
| <input type="checkbox"/> 請求の範囲 | 第 _____ 項、 | 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの |
| <input type="checkbox"/> 請求の範囲 | 第 _____ 項、 | 付の書簡と共に提出されたもの |
| <input type="checkbox"/> 図面 | 第 _____ ページ/図、 | 出願時に提出されたもの |
| <input type="checkbox"/> 図面 | 第 _____ ページ/図、 | 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの |
| <input type="checkbox"/> 図面 | 第 _____ ページ/図、 | 付の書簡と共に提出されたもの |
| <input type="checkbox"/> 明細書の配列表の部分 | 第 _____ ページ、 | 出願時に提出されたもの |
| <input type="checkbox"/> 明細書の配列表の部分 | 第 _____ ページ、 | 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの |
| <input type="checkbox"/> 明細書の配列表の部分 | 第 _____ ページ、 | 付の書簡と共に提出されたもの |

2. 上記の出願書類の言語は、下記に示す場合を除くほか、この国際出願の言語である。

上記の書類は、下記の言語である _____ 語である。

- ☐ 国際調査のために提出されたPCT規則23.1(b)にいう翻訳文の言語
- ☐ PCT規則48.3(b)にいう国際公開の言語
- ☐ 国際予備審査のために提出されたPCT規則55.2または55.3にいう翻訳文の言語

3. この国際出願は、ヌクレオチド又はアミノ酸配列を含んでおり、次の配列表に基づき見解書を作成した。

- ☐ この国際出願に含まれる書面による配列表
- ☐ この国際出願と共に提出された磁気ディスクによる配列表
- ☐ 出願後に、この国際予備審査(または調査)機関に提出された書面による配列表
- ☐ 出願後に、この国際予備審査(または調査)機関に提出された磁気ディスクによる配列表
- ☐ 出願後に提出した書面による配列表が出願時における国際出願の開示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述書の提出があった
- ☐ 書面による配列表に記載した配列と磁気ディスクによる配列表に記載した配列が同一である旨の陳述書の提出があった。

4. 補正により、下記の書類が削除された。

- ☐ 明細書 第 _____ ページ
- ☐ 請求の範囲 第 _____ 項
- ☐ 図面 図面の第 _____ ページ/図

5. ☐ この見解書は、補充欄に示したように、補正が出願時における開示の範囲を越えてされたものと認められるので、その補正がされなかったものとして作成した。(PCT規則70.2(c))

V. 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての法第13条（PCT規則66.2(a)(ii)に定める見解、それを裏付ける文献及び説明

1. 見解

新規性 (N)

請求の範囲

有

請求の範囲 1-8

無

進歩性 (IS)

請求の範囲

有

請求の範囲 1-8

無

産業上の利用可能性 (IA)

請求の範囲

有

請求の範囲 1-8

無

2. 文献及び説明

文献1: JP 11-214746 A(日亜化学工業株式会社), 1999. 08. 06, [0010]-[0018], 図2

文献2: JP 2000-216494 A(三洋電機株式会社), 2000. 08. 04, [0033], 図1

文献3: JP 8-70139 A(日亜化学工業株式会社), 1996. 03. 12, [0019]-[0022]
[0032]-[0036], 図3文献4: JP 2000-58917 A(パイオニア株式会社), 2000. 02. 25, 全文, 全図
& US 6259122 B1文献5: JP 9-312416 A(豊田合成株式会社), 1997. 12. 02, [0010]-[0011], 図1
& US 5959401 A

文献2-5は国際調査報告に提示された文献であり、文献1は見解書において追加提示する文献である。

文献1には、第3の窒化物半導体層（クラック防止層）のドーパント濃度が第2の窒化物半導体層（コンタクト層）のドーパント濃度よりも小である構成が記載されている。

文献2には、InGaNクラック防止層が記載されている。

文献3には、InGaNバッファ層が記載されている。

文献4には、周知な窒化物半導体発光素子の構造が記載されている。

文献5には、コンタクト層のドーパント濃度を大とする構成が開示されている。

・請求の範囲1-8

文献1に記載されている。

ドーパント濃度の濃度範囲は当業者が適宜設定し得る事項である。

